ATENTAMT

Offenlegungsschrift 28 18 103

Aktenzeichen:

P 28 18 103.5

Anmeldetag:

25. 4.78

Offenlegungstag:

8.11.79

43

®

2

1 2

Unionspriorität:

39 39 39

64) Bezeichnung:

Verfahren zur Herstellung von aus einer Vielzahl von auf einer

Glasträgerplatte angeordneten parallel zueinander ausgerichteten

elektrisch leitenden Streifen bestehenden Polarisatoren

0

Anmelder:

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München

0

Erfinder:

Rehme, Hans, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., 8011 Zorneding;

Krüger, Hans, Dipl.-Phys., 8000 München

66) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE-OS 26 57 090

GB

14 62 618

32 91 871

US-Z: Applied Optics, Vol 15, New York 1976,

S.1905-1906

✓ VPA 78 P 7 0 4 2 BRD

Patentansprüche.

- 1. Verfahren zur Herstellung von aus einer Vielzahl von auf einer Glasträgerplatte angeordneten parallel zueinander ausgerichteten elektrisch leitenden Streifen mit einem Rastermaß von ca. 1/10 der Lichtwellenlänge, gekennzeichnet, daß ein erster durch Verfahrensschritt vorgesehen ist, bei dem auf die Glasträgerplatte (3) durch Bedampfen unter einem vorgegebenen Bedampfungswinkel eine wellige, dünenartige Schicht (4) aus leitfähigem Material mit senkrecht zur Bedampfungsrichtung ausgerichteter gleichmäßiger Oberflächenwelligkeit mit einer Periode von ca. 50 nm aufgebracht wird, und daß ein zweiter Verfahrensschritt vorgesehen ist, bei dem eine vorgegebene Stärke der dünenartigen Schicht (4) durch Teilchenbeschuß unter einem vorgegebenen Beschußwinkel abgetragen wird, so daß eine Anordnung einer Vielzahl von parallel zueinander ausgerichteter, voneinander getrennter und damit elektrisch gegeneinander isolierender Mikrostreifen (2) auf der Glasträgerplatte (3) entsteht. * bestehenden Polarisatoren
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-ken zeichnet, daß für den ersten Verfahrensschritt ein Bedampfungswinkel vorgesehen ist, unter dem eine elektrisch leitende ebene Schicht (5) auf der Glasträgerplatte (3) entsteht, und daß anstelle des zweiten Verfahrensschrittes ein Verfahrensschritt vorgesehen ist, bei dem durch Materialabtrag mittels unter einem Winkel zur Bearbeitungsebene ausgerichteten Teilchenbeschusses eine Welligkeit der ursprünglich ebenen Schicht (5) entsteht, so daß eine vorgegebene Anordnung von Mikrostreifen (2) auf der Glasträgerplatte (3) entsteht.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein erster Verfahrens-

schritt vorgesehen ist, bei dem in die Oberfläche der Glasträgerplatte (3) durch Teilchenbeschuß unter einem vorgegebenen Beschußauftreffwinkel (\mathcal{P}) mittels Teilchen (6) ein Mikrorillenmuster eingeprägt wird, und daß ein Bedampfen während eines zweiten Verfahrensschrittes senkrecht zur Längsausdehnung der Mikrorillen und unter einem vorgegebenen Bedampfungsauftreffwinkel (β) durchgeführt wird, so daß jeweils nur auf den der Bedampfungsquelle zugewandten Innenfläche der Mikrorillen Material abgelagert wird, wodurch eine vorgegebene Anordnung von Mikrostreifen (2) auf der Glasträgerplatte (3) entsteht.

- 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch k e n n z e i c h n e t , daß ein erster Verfahrensschritt vorgesehen ist, bei dem zur Ausbildung einer einheitlichen periodischen Oberflächenstruktur auf der Glasträgerplatte (3) ein solcher Auftreffwinkel (\mathscr{S}_1) von Teilchen (6) eingestellt ist, daß sich eine Periode >50 nm < 5000 nm ergibt, und daß ein zweiter Verfahrensschritt vorgesehen ist, bei dem mittels einer Bedampfungsquelle, die senkrecht zur Längsausdehnung der im ersten Verfahrensschritt erzeugten Mikrorillen orientiert ist, eine Bedampfung mit elektrisch leitendem Material unter einem vorgegebenen streifenden Bedampfungsauftreffwinkel (β) durchgeführt wird, so daß jeweils nur auf den der Bedampfungsquelle zugewandten Innenflächen der betreffenden Mikrorillen Material abgelagert wird, wodurch eine vorgegebene Anordnung von Mikrostreifen (2) auf der Glasträgerplatte (3) entsteht, die insgesamt eine Flüssigkristallmoleküle mit definiertem Anstellwinkel orientierende Oberflächenstruktur aufweist.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die zu bearbeitende, Glasträgerplatte (3) zur Durchführung des zweiten Verfahrensschrittes um eine senkrecht auf ihrer Bear-

3 VPA 78 P 7 0 4 2 BRD beitungsebene (A-B-C-D) stehende Achse gedreht wird.

- 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Glasträgerplatte (3) um 90° gedreht wird.
- 7. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch ge-kennzeich net, daß die Teilchenkanone zur Durchführung des zweiten Verfahrensschrittes um eine senkrecht auf der Bearbeitungsebene (A-B-C-D) der Glasträgerplatte (3) stehende Achse geschwenkt wird.
- 8. Verfahren nach Anspruch 4, dad urch gekennzeichnet, daß zur Durchführung des ersten Verfahrensschrittes eine erste Teilchenkanone vorgesehen ist, daß zur Durchführung des zweiten Verfahrensschrittes eine zweite Teilchenkanone vorgesehen ist und daß die zweite Teilchenkanone gegenüber der ersten Teilchenkanone um eine senkrecht auf der Bearbeitungsebene (A-B-C-D) der Glasträgerplatte (3) stehende Achse versetzt angeordnet ist.
- 9. Verfahren nach den Ansprüchen 4 bis 6, dad urch geken nzeich net, daß zur Erzeugung eines Parallelrillenmusters mit um einen vorgegebenen Anstellwinkel (9) gegenüber der Bearbeitungsebene (A-B-C-D) geneigter Orientierung der Flüssigkristallmoleküle und mit einer vorgegebenen Rillentiefe (\mathcal{T}), bei dem der erste Auftreffwinkel (\mathcal{P} 1) und der zweite Auftreffwinkel (\mathcal{P} 2) in einem vorgegebenen Verhältnis zueinander eingestellt sind.
- 10. Verfahren nach Anspruch 9, dad urch gekennzeichnet, daß derzweite Auftreffwinkel (92) 900 beträgt.

- 4 VPA 78 P 7 0 4 2 BRD
- 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 10, da-durch gekennzeichnet, daß die Reihenfolge des ersten Verfahrensschrittes mit dem zweiten Verfahrensschritt vertauscht ist.
- 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 11, da-durch gekennzeichnet, daß die Oberflächenstrukturierung der Glasträgerplatte (3) parallel und/oder senkrecht zu den Kanten (A-B, B-C, C-D, D-A) der Bearbeitungsebene (A-B-C-D) vorzunehmen ist.
- 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 11, da durch gekennzeichen the t, daß die Oberflächenstrukturierung der Glasträgerplatte (3) schräg zu den Kanten (A-B, B-C, C-D, D-A) der Bearbeitungsebene (A-B-C-D) vorzunehmen ist.
- 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-durch gekennzeichnet, daß elektrisch neutrale Teilchen für den Teilchenbeschuß vorgesehen sind.
- 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-durch gekennzeichnet, daß Ionen für den Teilchenbeschuß vorgesehen sind.
- 16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-kennzeich net, daß eine durch Teilchenbeschuß mittels Ionen auftretende elektrische Aufladung der bearbeiteten Glasträgerplatte (3) durch an sich bekannte Maßnahmen neutralisiert wird.
- 17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-durch gekennzeichnet, daß anstelle des Bedampfens ein Auftragen von Material mittels Sputtern vorgesehen ist.

5 VPA

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-durch gekennzeichnet, daß anstelle des Bedampfens ein Auftragen von Material mittels selektiver chemischer Abscheidung vorgesehen ist.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Berlin und München

Unser Zeichen VPA 78 P 7 0 4 2 BRD

- 5 Verfahren zur Herstellung von aus einer Vielzahl von auf einer Glasträgerplatte angeordneten parallel zueinander ausgerichteten elektrisch leitenden Streifen bestehenden Polarisatoren.
- 10 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von aus einer Vielzahl von auf einer Glasträgerplatte angeordneten parallel zueinander ausgerichteten elektrisch leitenden Streifen bestehenden Polarisatoren mit einem Rastermaß von ca. 1/10 der Lichtwellenlänge.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein kostengünstiges und leicht reproduzierbares Verfahren anzugeben, mit dessen Hilfe Polarisationsfilter der angegebenen Art herzustellen sind. Dabei liegt die Erkenntnis zugrunde,

20 daß die für Zwecke der Lichtpolarisation nötigen Abstände und Breiten von parallel zueinander verlaufenden elektrisch leitenden, durch an sich bekanntes Auftragen bzw. Abtragen von Metallschichten auf Glasträgerplatten durch Schrägbedampfen bzw. Schrägbeschuß erhaltbar sind.

Pap 1 Plr / 25.4.1978

15

Die genannte Aufgabe wird durch ein eingangs erwähntes Verfahren gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist. daß ein erster Verfahrensschritt vorgesehen ist. bei dem auf eine Glasträgerplatte durch Bedampfen unter einem vorge-5 gebenen Bedampfungswinkel eine wellige, dünenartige Schicht aus leitfähigem Material mit senkrecht zur Bedampfungsrichtung ausgerichteter gleichmäßiger Oberflächenwelligkeit mit einer Periode von ca. 50 nm aufgebracht wird und daß ein zweiter Verfahrensschritt vor-10 gesehen ist, bei dem eine vorgegebene Stärke der dünenartigen Schicht durch Teilchenbeschuß unter einem vorgegebenen Beschußwinkel abgetragen wird, so daß eine Anordnung einer Vielzahl von parallel zueinander ausgerichteter, voneinander getrennter und damit elektrisch 15 gegeneinander isolierter Mikrostreifen auf der Glasträgerplatte entsteht.

Die Erfindung bietet den Vorteil, daß ein kostengünstiges und leicht reproduzierbares Herstellungsverfahren für 20 Polarisatoren gegeben ist und daß die Lebensdauer von nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Polarisatoren gegenüber herkömmlichen Polarisatoren erhöht ist.

Eine Weiterbildung der Erfindung ist dadurch gekennzeich25 net, daß ein erster Verfahrensschritt vorgesehen ist, bei
dem zur Ausbildung einer einheitlichen periodischen Oberflächenstruktur auf der Glasträgerplatte ein solcher Auftreffwinkel von Teilchen eingestellt ist, daß sich eine
Periode >50 nm < 5000 nm ergibt, und daß ein zweiter Ver30 fahrensschritt vorgesehen ist, bei dem mittels einer Bedampfungsquelle, die senkrecht zur Längsausdehnung der
im ersten Verfahrensschritt erzeugten Mikrorillen
orientiert ist, eine Bedampfung mit elektrisch leitendem
Material unter einem vorgegebenen streifenden Bedampfungs35 auftreffwinkel durchgeführt wird, so daß jeweils nur auf
den der Bedampfungsquelle zugewandten Innenflächen der

& VPA 78 P 7 0 4 2 BRD

betreffenden Mikrorillen Material abgelagert wird, wodurch eine vorgegebene Anordnung von Mikrostreifen auf der Glasträgerplatte entsteht, die insgesamt eine Flüssigkristallmoleküle mit definiertem Anstellwinkel orientieren-5 de Oberflächenstruktur aufweist.

Die Weiterbildung der Erfindung bietet den Vorteil, daß mit einer geringen Anzahl von Verfahrensschritten Polarisatoren herstellbar sind, denen eine Oberflächenstruktur

- 10 der Glasträgerplatte unterlagert ist, die das für Flüssigkristallanzeigen erforderliche Orientieren der Flüssigkristallmoleküle erlaubt, so daß insgesamt Flüssigkristallanzeigen mit optimalen Eigenschaften herstellbar sind.
- 15 Die Erfindung wird im folgenden anhand mehrerer, Ausführungsbeispiele für die Erfindung betreffender Figuren erläutert.
- Fig. 1 zeigt schematisch in Draufsicht einen Polarisa20 tor 1, der aus einer Glasträgerplatte und auf
 dieser in der gezeigten Weise angeordneten
 Mikrostreifen 2 besteht.
- Fig. 2 zeigt ausschnittsweise im Querschnitt eine Glasträgerplatte 3 und eine auf diese durch Schrägbedampfung aufgebrachte, wellige, dünenartige Schicht 4.
- Fig. 3 zeigt ebenfalls ausschnittsweise im Querschnitt 30 eine Glasträgerplatte 3 mit einer auf diese aufgebrachte ebenen Schicht 5.
- Fig. 4 zeigt wiederum ausschnittsweise den Querschnitt einer Glasträgerplatte 3, auf der durch die erfindungsgemäßen Verfahrensschritte erzielbare Mikrostreifen 2, die voneinander getrennt und da-

78 P 7 0 4 2 BRD

mit elektrisch gegeneinander isoliert sind, lagern.

Fig. 5 zeigt ausschnittsweise den Querschnitt einer Glasträgerplatte 3, die gemäß einem erfindungsgemäßen Verfahrensschritt mit Teilchen 6 unter einem Beschußauftreffwinkel 9 beschossen wird.

5

- Fig. 6 zeigt ausschnittsweise den Querschnitt einer Glasträgerplatte 3, in deren Oberfläche nach einem
 10 Teilchenbeschuß gemäß Fig. 5 eine Vielzahl von parallel zueinander angeordneten Mikrorillen eingeprägt ist, deren einer Bedampfungsquelle zugewandten Innenflächen durch unter einem Bedampfungsauftreffwinkel \(\beta \) auftreffendes Material 7 mit einer elektrisch leitenden Oberfläche versehen werden, so daß eine Vielzahl von parallel zueinander ausgerichteten, voneinander getrennten und damit elektrisch gegeneinander isolierten Mikrostreifen 2 entsteht.
- Fig. 7 zeigt im Querschnitt eine Glasträgerplatte 3, deren Oberfläche in einem ersten Verfahrensschritt mit Teilchen 6 unter einem ersten Auftreffwinkel \mathcal{P} 1 innerhalb eines ersten Winkelbereiches \emptyset 1 und in einem zweiten Verfahrensschritt mit Teilchen 6 unter einem zweiten Auftreffwinkel \mathcal{P} 2 innerhalb eines zweiten Winkelbereiches \emptyset 2 beschossen wird.
- Fig. 8 zeigt in perspektivischer Darstellung eine Glasträgerplatte 3, deren Oberfläche mit Teilchen unter
 einem ersten Auftreffwinkel 91 beschossen wird,
 so daß eine erste Oberflächenstruktur 8 entsteht.
- Fig. 9 zeigt ebenfalls in perspektivischer Ansicht die Glasträgerplatte 3, deren Oberfläche mit Teilchen unter einem zweiten Auftreffwinkel φ 2 beschossen

909845/0061

78 P 7 0 4 2 BRD

F VPA

wird, wobei eine zweite Oberflächenstruktur 9 entsteht.

Fig. 10 zeigt eine Glasträgerplatte 3, auf deren Oberfläche in der Bearbeitungsebene A-B-C-D eine
Rillenstruktur erzeugt wird, indem in einem ersten
Arbeitsgang durch Teilchenbeschuß unter dem Auftreffwinkel 1 eine Rillenstruktur 1 gemäß Fig. 8
und in einem zweiten Arbeitsgang durch Teilchenbeschuß unter dem Auftreffwinkel 2 eine zur
Rillenstruktur 1 parallele Rillenstruktur 2 gemäß Fig. 9 hergestellt wird.

Wie bereits erläutert, zeigt Figur 1 schematisch in

15 Draufsicht einen Polarisator 1, der aus einer Glasträgerplatte und auf dieser in der gezeigten Weise angeordneten
Mikrostreifen 2 besteht. Die Wirkung eines solchen Polarisators beruht bekanntlich darauf, daß das sich ergebende
Abstands-/Breitenraster der Anordnung von Mikrostreifen

20 der mittleren Wellenlänge sichtbaren Lichtes angepaßt
ist.

Figur 2 zeigt, wie ebenfalls bereits erläutert, ausschnittsweise im Querschnitt eine Glasträgerplatte 3 und 25 eine auf diese durch Schrägbedampfung aufgebrachte wellige, dünenartige Schicht 4. Die Ausbildung einer solchen welligen Oberfläche ist bei Bedampfung unter einem bestimmten Bedampfungswinkel erreichbar. Es ist nun eine Eigenart einer solchen Bedampfungsmethode, daß 30 bei geeignetem Bedampfungswinkel die Welligkeit der Oberfläche eine Periode von ca. 500Å aufweist, die gut an die Funktion eines damit realisierten Polarisators für sichtbares Licht angepaßt ist. Aus der dünenartigen Schicht 4 ist nun gemäß Figur 4 eine Anordnung von 35 parallel zueinander ausgerichteten Mikrostreifen 2 dadurch zu gewinnen, daß in einem weiteren Verfahrens-

78 P 7 0 4 2 BRD SI VPA

schritt ein Teilchenbeschuß unter einem vorgegebenen Beschußwinkel vorgenommen wird, mittels dessen ein Abtragen von Material erfolgt. Das Abtragen von Material mittels Teilchenbeschuß ist an sich bekannt.

5

Figur 3 zeigt, wie bereits erläutert, ebenfalls ausschnittsweise im Querschnitt eine Glasträgerplatte 3, mit einer auf diese aufgebrachten ebenen Schicht 5. Eine solche ebene Schicht entsteht gemäß einer Weiterbildung 10 der Erfindung dadurch, daß die Bedampfung der Glasträgerplatte 3 unter einem vorzugsweise 90° betragenden Bedampfungswinkel vorgenommen wird. Zum Erzeugen einer welligen Oberflächenstruktur ist in diesem Ausführungsbeispiel ein Teilchenbeschuß unter einem vorgegebenen 15 Auftreffwinkel vorgesehen, durch den Mikrorillen in die ebene Schicht 5 eingeprägt werden. Die endgültige Oberflächenstruktur gemäß Figur 4 wird nach dieser Weiterbildung der Erfindung dadurch erreicht, daß anstelle des zweiten Verfahrensschrittes ein Verfahrensschritt vorge-

20 sehen ist, bei dem durch Materialabtrag mittels unter einem Winkel zur Bearbeitungsebene ausgerichteten Teilchenbeschusses eine Welligkeit der ursprünglich ebenen Schicht 5 entsteht, so daß eine vorgegebene Anordnung von Mikrostreifen 2 auf der Glasträgerplatte 3 entsteht.

25

Wie bereits erläutert, zeigt Figur 5 ausschnittsweise den Querschnitt einer Glasträgerplatte 3, die gemäß einem erfindungsgemäßen Verfahrensschritt mit Teilchen 6 unter einem Beschußauftreffwinkel ${\mathscr S}$ beschossen wird. Durch die-30 sen Teilchenbeschuß entsteht ein je nach Wahl des Beschußauftreffwinkels arphi parallel $ext{der}$ quer $ext{zur}$ Beschußrichtung orientiertes Mikrorillenmuster, das in einem zweiten Verfahrensschritt gemäß Figur 6 durch Bedampfen senkrecht zur Längsausdehnung der Mikrorillen unter einem 35 vorgegebenen Bedampfungsauftreffwinkel eta durchgeführt wird, so daß jeweils nur auf den der Bedampfungsquelle

✓ VPA 78 P 7 0 4 2 BRD

zugewandten Innenflächen der Mikrorillen Material abgelagert wird, wodurch eine vorgegebene Anordnung von Mikrostreifen 2 auf der Glasträgerplatte 5 entsteht.

- 5 Figur 7 zeigt, wie bereits erläutert, im Querschnitt eine Glasträgerplatte 3, deren Oberfläche in einem ersten Verfahrensschritt mit Teilchen 6 unter einem ersten Auftreffwinkel $\mathcal P$ 1 innerhalb eines ersten Winkelbereiches \emptyset 1 und in einem zweiten Verfahrensschritt mit Teilchen 6
- 10 unter einem zweiten Auftreffwinkel %2 innerhalb eines zweiten Winkelbereiches $\emptyset2$ beschossen wird. Die sich jeweils aus dem Teilchenbeschuß unter dem ersten Auftreffwinkel %1 bzw. dem zweiten Auftreffwinkel %2 ergebenden Oberflächenstrukturen 8 und 9 sind aus den Figuren
- 15 8 und 9 ersichtlich. Im ersteren Fall verlaufen die entstandenen Mikrorillen in Richtung des Teilchenbeschusses, im zweiten Fall verlaufen die entstandenen Mikrorillen senkrecht zur Beschußrichtung, vergl. Figuren 8 und 9. Die beiden Oberflächenstrukturen 8 und 9 überlagern sich,
- 20 d. h., die eine Struktur moduliert die andere. Wird die derart strukturierte Glasträgerplatte in einem dritten Verfahrensschritt mittels einer Bedampfungsquelle, die senkrecht zur Längsausdehnung der im ersten oder im zweiten Verfahrensschritt erzeugten Mikrorillen orientiert
- 25 ist bedampft, so entsteht eine Ablagerung von Material auf den der Bedampfungsquelle zugewandten Innenflächen der Mikrorillen, wodurch insgesamt eine Anordnung von Mikrostreifen 2 auf der Glasträgerplatte 3 entsteht, die außerdem eine Flüssigkristallmoleküle orientierende
- 30 Funktion aufweist.

Zur Erzielung besonderer Eigenschaften, nämlich zur Ausbildung eines optimalen Wertes für die Rillengeometrie und eines optimalen Wertes für den Anstellwinkel 0 wird vorteilhafterweise die Glasträgerplatte 3 zur Durchführung des zweiten Teilchenbeschusses gemäß Fig. 7 bzw.

№ VPA 78 P 7 0 4 2 BRD

Fig. 9 die Bearbeitungsebene A-B-C-D der Glasträgerplatte um eine senkrecht auf ihr stehende Achse gedreht. Der Drehungswinkel beträgt dabei zweckmäßig 90°. Der zweite Auftreffwinkel \$\mathcal{P}\$2 kann zur Erzielung eines besonderes vorgegebenen Verhältnisses der Rillengeometrie zum Anstellwinkel 9 90° betragen.

Prinzipiell ist die Reihenfolge des Teilchenbeschusses unter dem ersten Auftreffwinkel 91 bzw. dem zweiten Auf10 treffwinkel 92 vertauschbar. Die Oberflächenstrukturierung der Glasträgerplatte 3 kann je nach Verwendungszweck des fertigen Produktes parallel und/oder senkrecht
zu den Kanten A-B, B-C, C-D, D-A der Bearbeitungsebene
A-B-C-D oder schräg zu diesen Kanten vorgenommen werden.

Für den Teilchenbeschuß können elektrisch neutrale Teilchen oder beispielsweise Ionen vorgesehen sein. Für den
Fall, daß Ionen verwendet werden, ist vorgesehen, gegebenenfalls auftretende störende elektrische Aufladungen
20 der bearbeiteten Glasträgerplatte ohne einen zusätzlichen
Verfahrensschritt durch an sich bekannte Maßnahmen zu
neutralisieren.

Statt eines Bedampfens kann ein Auftragen von Material
25 mittels Sputtern vorgesehen sein. Es ist außerdem in
einer Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, daß anstelle des Bedampfens ein Auftragen von Material mittels
selektiver chemischer Abscheidung nach an sich bekannten
Verfahren vorzunehmen ist.

Die polarisierende Schicht, die durch die Anordnung parallel zueinander orientierter Mikrostreifen gegeben ist, ist bei Anordnung über einer Flüssigkristallanzeige-Einrichtung zur Verhütung störender elektrisch 35 leitender Verbindungen durch eine Isolierschicht, beispielsweise aus Quarz oder ähnlichen geeigneten Schichten

> VPA 78 P 7 0 4 2 BRD

zu trennen.

Der Anstellwinkel der Orientierung ist auch vorteilhafterweise durch einen dritten Verfahrensschritt, 5 nämlich durch schräges Aufdampfen oder schräges Abtragen mittels Teilchenbeschuß oder schräges Überreiben einstellbar.

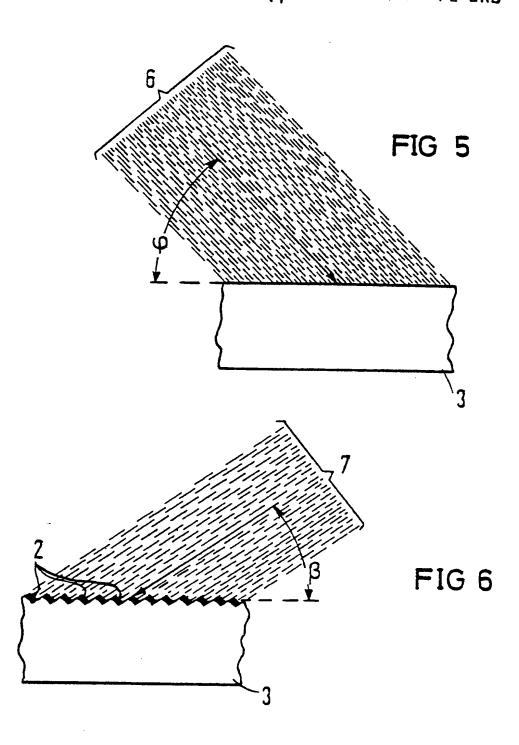
- 18 Patentansprüche
- 10 Figuren

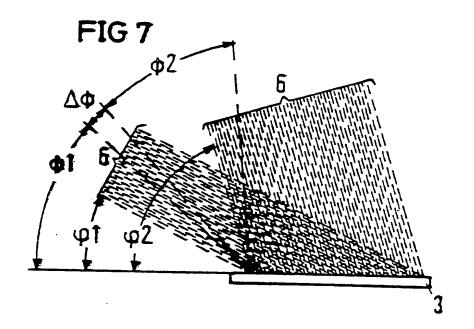
Zusammenfassung.

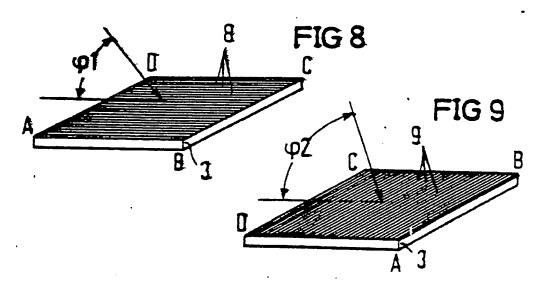
Verfahren zur Herstellung von aus einer Vielzahl von auf einer Glasträgerplatte angeordneten parallel zuein-5 ander ausgerichteten elektrisch leitenden Streifen bestehenden Polarisatoren.

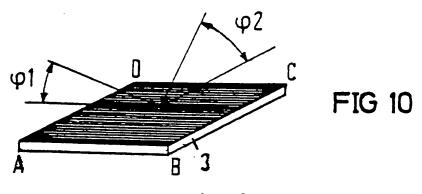
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von aus einer Vielzahl von auf einer Glasträgerplatte ange-10 ordneten parallel zueinander ausgerichteten elektrisch leitenden Streifen bestehenden Polarisatoren mit einem Rastermaß von ca. 1/10 der Lichtwellenlänge. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß ein erster Verfahrensschritt vorgesehen ist, bei dem auf die Glas-15 trägerplatte durch Bedampfen unter einem vorgegebenen Bedampfungswinkel eine wellige, dünenartige Schicht aus leitfähigem Material mit senkrecht zur Bedampfungsrichtung ausgerichteter gleichmäßiger Oberflächenwelligkeit mit einer Pierode von ca. 50 nm aufgebracht wird, 20 und daß ein zweiter Verfahrensschritt vorgesehen ist, bei dem eine vorgegebene Stärke der dünenartigen Schicht durch Teilchenbeschuß unter einem vorgegebenen Beschußwinkel abgetragen wird, so daß eine Anordnung einer Vielzahl von parallel zueinander ausgerichteter, voneinander 25 getrennter und damit elektrisch gegeneinander isolierter Mikrostreifen auf der Glasträgerplatte entsteht.

16 Leerseite









909845/0061

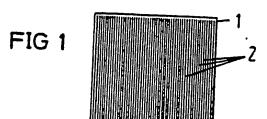
- 19-

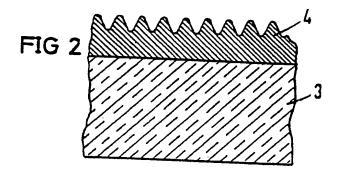
Nummer: Int. Cl.²: Anmeldetag: Offenlegungstag:

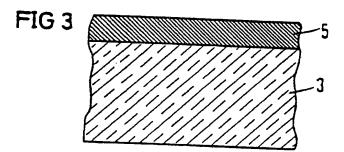
28 18 103 G 02 B 5/30 25. April 1978 8. November 1979

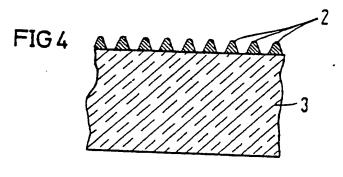
2818103

78 P 7 0 4 2 BRD 1/3









909845/0061